

Verlässliche Echtzeitsysteme

Grundlagen

17. November 2024

Peter Wägemann

Lehrstuhl für Systemsoftware

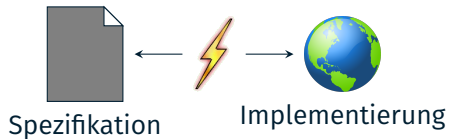
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

<https://sys.cs.fau.de>

- ⚠ Wir kümmern uns ausschließlich um **Fehler**
 - Das ist nur ein kleiner Aspekt *zuverlässiger Systeme!*
- ☞ Fehler stellen jedoch einen **sehr komplexen Aspekt** dar
 - *Was genau ist ein Fehler überhaupt?*
 - Beeinflusst jeder Fehler das Verhalten eines Systems?
- Wie **schwerwiegend** ist ein Fehler?
 - Welchen *Schaden* kann ein Fehler verursachen?
- Wo entstehen Fehler und was beeinflussen sie?
 - *Software- vs. Hardware-Fehler*
 - Grundlegende *Klassifikation, Ursachen* und *Entstehung*
- Was bedeutet es, mit Fehlern umgehen zu können?
 - Worin unterscheiden sich etwa *Zuverlässigkeit* und *Verfügbarkeit*?

- 1 Fehler
- 2 Verlässlichkeitsmodelle
- 3 Fehler und Systementwurf
- 4 Software- und Hardwarefehler
- 5 Zusammenfassung

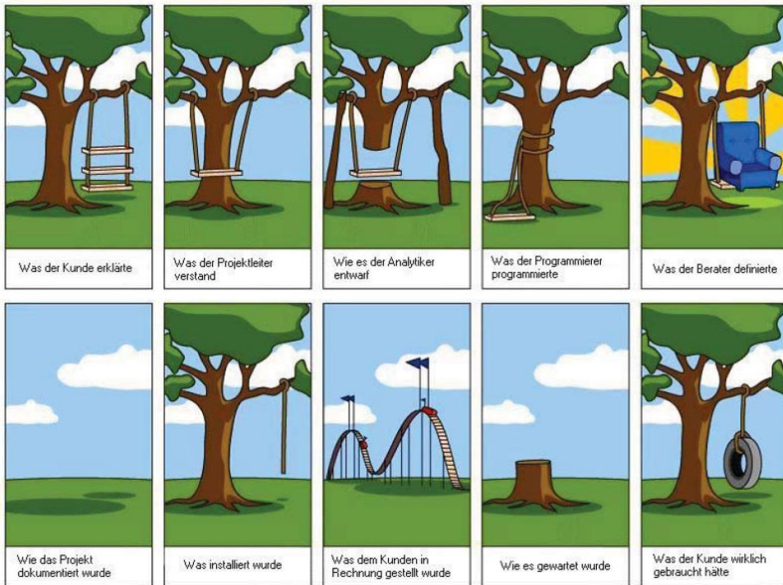
Definition: Fehler



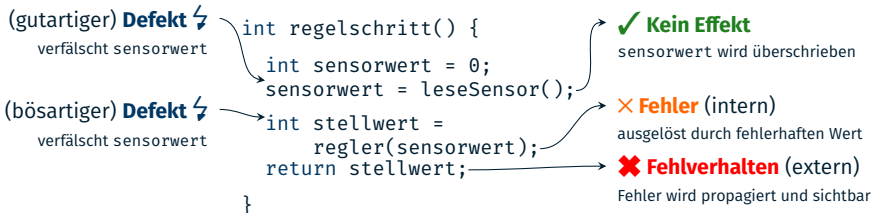
- ☞ Gemäß DIN EN ISO 8402:1995-08 [4] ist ein **Fehler** die „Nichterfüllung einer festgelegten Forderung“
 - Fehler kennen demzufolge viele Ausprägungen
 - Sie können lediglich als *störend* empfunden werden
 - Die eigentliche Funktion ist noch vorhanden, es geht aber Komfort verloren
 - Sie können die Funktionalität *beeinträchtigen*
 - Das Abspielen eines Videos „ruckelt“, die Bildrate wird nicht erreicht
 - Sie können aber auch zum vollständigen *Systemversagen* führen
 - Eine fehlerhafte Fluglageregelung kann den I4Copter abstürzen lassen
- ⚠ **Wichtig:** Bezugspunkt ist die Spezifikation \leadsto *Verifikation*
 - Haben wir das System korrekt implementiert?

Abgrenzung: Keine Validierung

Haben wir das korrekte System implementiert?



Wann ist ein Fehler nun ein Fehler?



1. Defekte (engl. *faults*) sind die Quelle allen Übels

- Ursachen: Software-Bugs, Produktionsfehler, äußere Einflüsse, ...
- Beziehen sich auf *Strukturelemente* (Daten, Anweisungen, ...)
- *Gutartige Defekte* (engl. *benign faults*) führen *nicht* zu einem Fehler

2. Manifestation eines Defekts ist ein *innerer Fehler* (engl. *error*)

→ Defekt ist also *bösertig* (engl. *malign fault*)

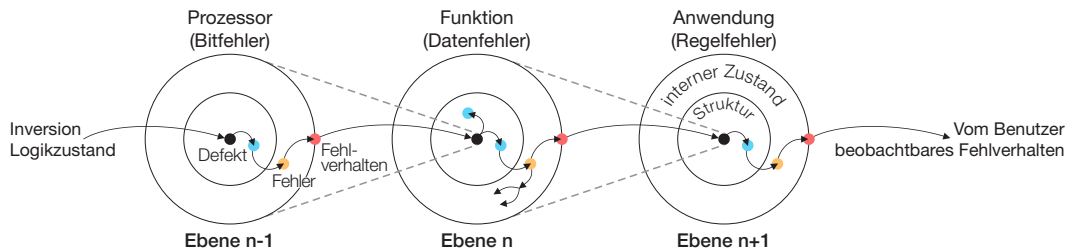
- Fehler beziehen sich auf den *nicht sichtbaren, inneren Zustand*

3. Sichtbarkeit des Fehlers führt zum *Fehlverhalten* (engl. *failure*)

- Beziehen sich auf das *beobachtbare Verhalten*

☞ Die sogenannte *Fehlerkette* [13, Kapitel 1] (*fault* \leadsto *error* \leadsto *failure*)

Fehlerkette: Sichtbarkeit und Betrachtungsebene



- Über die Fehlerkette *pflanzen sich Fehler im System fort*
 - Gutartige Defekte haben *keinen Einfluss*
 - Bösartige Defekte/innere Fehler beeinflussen den *internen Zustand*
 - Bezogen auf die aktuelle Betrachtungsebene
 - Intern kann sich der Fehler zunächst unbemerkt weiter verbreiten
 - Äußere Fehler bezeichnen ein *Fehlverhalten* der *aktuellen Ebene*
- ⚠ Fehlerausbreitung kann schließlich zum beobachtbaren, *vollständigen Systemversagen* führen

- ☞ Fehler müssen nicht immer auftreten ...

Permanente Fehler (engl. *permanent fault/error/failure*)

- Bestehen eine **unbegrenzt lange Zeitdauer**
- Bis sie durch eine *korrigierende Maßnahme* behoben werden

Sporadische Fehler (engl. *intermittent fault/error/failure*)

- Treten **unregelmäßig** auf, häufen sich aber in vielen Fällen und ...
- sind oft **Vorboten drohender, permanenter Fehler**

Transiente Fehler (engl. *transient fault/error/failure*)

- Treten wie sporadische Fehler **unregelmäßig** auf ...
- Münden i. d. R. aber nicht in einem permanenten Fehler

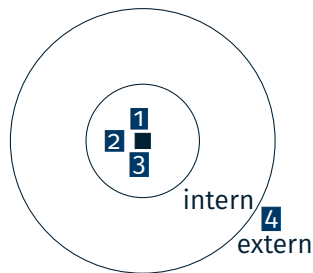
⚠ Implikationen aus der Fehlerkette:

- Normalerweise: transiente Defekte ↗ permanentes Fehlverhalten
- Möglich: permanenter Defekt ↘ transientes Fehlverhalten
 - Falls sie nur unregelmäßig den inneren Sichtbarkeitsbereich verlassen

Maßnahmen im Umgang mit Fehlern

Versuchen die Fehlerkette aufzubrechen

1. *Vorbeugung* – versucht die Entstehung von Defekten in der Produktion zu verhindern
 - z.B. durch Entwicklungsmethoden
2. *Entfernung* – vor der Auslieferung oder im Zuge einer planmäßigen *Wartung*
 - Erfordert die Erkennung von Defekten → *Qualitätssicherung*
3. *Erkennung* – Wo treten evtl. Defekte auf?
 - Ermöglicht die Entfernung
4. *Toleranz* – verhindert nicht den Defekt, aber die Fortpflanzung zum Fehlverhalten
 - z.B. durch Maskierung *innerer Fehler*

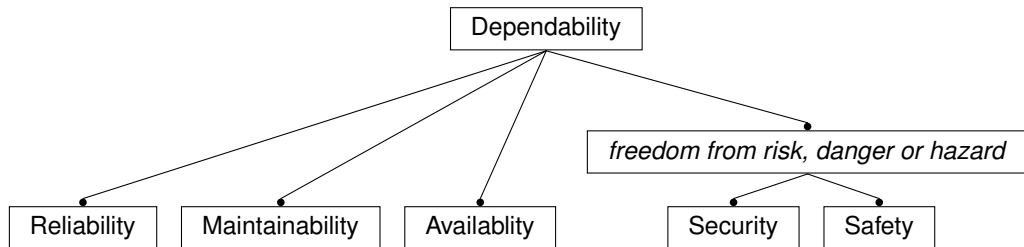


👉 Ziel: Reduktion des vom Benutzer beobachtbaren Fehlverhaltens

- ☞ Nicht jedes beobachtbare Fehlverhalten wird entdeckt:
 - *Unerkannte Datenfehler* (engl. *silent data corruption, SDC*)
 - **Unbemerkte Fehlerfortpflanzung** innerhalb oder außerhalb
 - Fehlerhafte Berechnungsergebnisse oder Ausgabewerte
 - ⚠ **Sehr, sehr schwer ausfindig zu machen**
 - Zusammenhang Ursache ↔ Fehlverhalten nicht erkennbar
 - **Fehlererkennung** verhindert die unbemerkte Fehlerausbreitung
 - Überführt unerkannte Datenfehler in erkannte Datenfehler
 - *Erkannte, nicht korrigierbare Fehler* (engl. *detected unrecoverable error, DUE*)
 - Eine Fortpflanzung kann gezielt unterbunden werden
 - Fehlerstellen lassen sich vergleichsweise einfach herausfinden, z. B. durch eine *Ablaufverfolgung* (engl. *backtrace*)
- Eine Fortführung der Funktion ist jedoch nicht möglich \leadsto *fail-stop*

- 1 Fehler
- 2 Verlässlichkeitsmodelle**
- 3 Fehler und Systementwurf
- 4 Software- und Hardwarefehler
- 5 Zusammenfassung

„Verlässlichkeit“ ist ein vielschichtiger Begriff

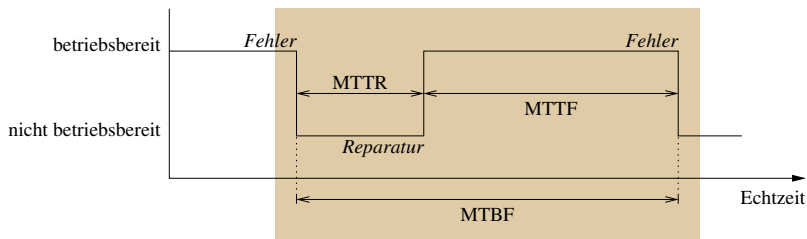


The trustworthiness of a computing system which allows reliance to be justifiably placed on the service it delivers. [6]

- ☞ $R(t)$: Wahrscheinlichkeit, dass ein System seinen Dienst bis zum Zeitpunkt t leisten wird, sofern es bei t_0 betriebsbereit war
 - Annahme: eine **konstante Fehlerrate** von λ Fehler/Stunde
 - Zuverlässigkeit zum Zeitpunkt t : $R(t) = \exp(-\lambda(t - t_0))$
 - mit $t - t_0$ gegeben in Stunden
 - Inverse $1/\lambda$ ist die (engl. *mean time to failure*) (MTTF)
- *Ultra-hohe Zuverlässigkeit* $\mapsto \lambda \leq 10^{-9}$ Fehler/Stunde
 - Beispiel: elektronisch gesteuerte Bremsanlage im Automobil
 - Kfz sei durchschnittlich eine Stunde täglich in Betrieb
 - jährlich nur ein Fehler pro eine Million Kfz
 - Beispiele: Eisenbahnsignalanlagen, Kernkraftwerküberwachung

- ☞ $M(d)$: Wahrscheinlichkeit, dass das System innerhalb Zeitspanne d wieder hergestellt ist
 - Ansatz: **konstante Reparaturrate** von μ Reparaturen/Stunde
 - Die Inverse $1/\mu$ ist dann die *mean time to repair* (MTTR)
- **Fundamentaler Konflikt** zwischen Zuverlässigkeit und Wartbarkeit
 - Ein wartbares System erfordert einen modularen Aufbau
 - Kleinste ersetzbare Einheit (engl. *smallest replaceable unit*, SDU)
 - Über Steckverbindungen lose gekoppelt mit anderen SDUs
 - Dadurch ist jedoch eine höhere (physikalische) Fehlerrate gegeben
 - Darüberhinaus verbuchen sich höhere Herstellungskosten
 - Ein zuverlässiges System ist *aus einem Guss* gefertigt (mechanisch-elektrisches System)...
 - Unterschiede zur Softwareentwicklung
- ⚠ Beim Entwurf von Produkten für den Massenmarkt geht die Zuverlässigkeit meist auf Kosten von Wartbarkeit

- ☞ Maß zur Bereitstellung einer Funktion vor dem Hintergrund eines abwechselnd korrekt und fehlerhaft arbeitenden Systems
 - Zeitanteil der *Betriebsbereitschaft*: $A = \text{MTTF} / (\text{MTTF} + \text{MTTR})$
 - $\text{MTTF} + \text{MTTR}$: *mean time between failures* (MTBF)



- ⚠ Hohe Verfügbarkeit bedeutet kurze MTTR und/oder lange MTTF

Security: *Schutz von Informationen* und Informationsverarbeitung vor „intelligenten“ Angreifern

- Allgemein in Bezug auf *Datenbasen*
 - *Vertraulichkeit* (engl. *confidentiality*)
 - *Datenschutz* (engl. *privacy*)
 - *Glaubwürdigkeit* (engl. *authenticity*)
- Speziell z.B. Diebstahlsicherung
 - *Kryptographie* (engl. *cryptography*)

Safety: *Schutz von Menschen* und Sachwerten vor dem Versagen technischer Systeme

- Zuverlässigkeit trotz **Fehlverhaltens**
 - Kosten liegen Größenordnungen über Normalbetrieb
- Abgrenzung von unkritischen, gutartigen Fehlern
- Oft ist *Zertifizierung* (engl. *certification*) erforderlich

Automobil eine Bestandsaufnahme vom Jahr 2005 ...

- Etwa 90 % der Innovationen im Auto bringt die Elektronik ein
 - Gut 80 % davon sind Software
- Etwa ein Drittel aller Pannen liegen an fehlerhafter Elektronik
 - Gut 80 % davon sind Softwarefehler

*Everything should be made as simple as possible, but no simpler.
(Albert Einstein)*

Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. (Antoine de Saint Exupery)

Buch: Simplicity is Complex (Hermann Kopetz) [10]

Verlässlichkeit unterscheidet sich je nach System

Je nachdem, wie kritisch sich ein einzelner Fehler auswirkt:

Hochverfügbare Systeme z. B. Telekommunikationstechnik

- Müssen ihren Dienst möglichst ununterbrochen verrichten
 - Einzelne Fehler sind jedoch verkraftbar (\leadsto *fail-soft*)
 - Sie werden meist auf höheren Ebenen abgefangen (z. B. TCP/IP)
- **Kurze Fehlererholung** steht im Vordergrund

Langlebige Systeme z. B. Satelliten

- Müssen auch nach Jahren noch funktionieren (\leadsto *fail-slow*)
 - Eine Fehlerbehebung ist oft technisch nicht möglich
- **Hohe Zuverlässigkeit** steht im Vordergrund

Sicherheitskritische Systeme z. B. Flugzeuge, Kernkraftwerke, Eisenbahn, Industrieanlagen, Medizintechnik ...

- Zuverlässig und ununterbrochene Funktion (\leadsto *fail-safe*)
 - Diese Anlagen sind nur sinnvoll, wenn sie im Betrieb sind!
- Hohe Ansprüche an **Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit**

- 1 Fehler
- 2 Verlässlichkeitsmodelle
- 3 Fehler und Systementwurf**
- 4 Software- und Hardwarefehler
- 5 Zusammenfassung

Schweregrad des Fehlverhaltens

- Klärung durch eine *Gefahrenanalyse und Risikobeurteilung*
 - *Identifikation* gefährlicher Ereignisse und
 - ihre *Klassifikation* hinsichtlich verschiedener Kriterien
- *Faustregel*: Risiko = Wahrscheinlichkeit × Schweregrad
 - Wahrscheinlichkeit: Auftretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses
 - der Schweregrad bemisst sich häufig als „Konsequenz / Ereignis“
→ Risiko \approx Wahrscheinlichkeit der Konsequenz
 - der entstehende *finanzielle Schaden* ist oft ein Maß für die Konsequenz
- Normen reglementieren die Klassifikation, z. B. ISO 26262 [7]

■ Kriterien:

- Schweregrad
- Wahrscheinlichkeit
- Kontrollierbarkeit

Schweregrade nach ISO 26262:

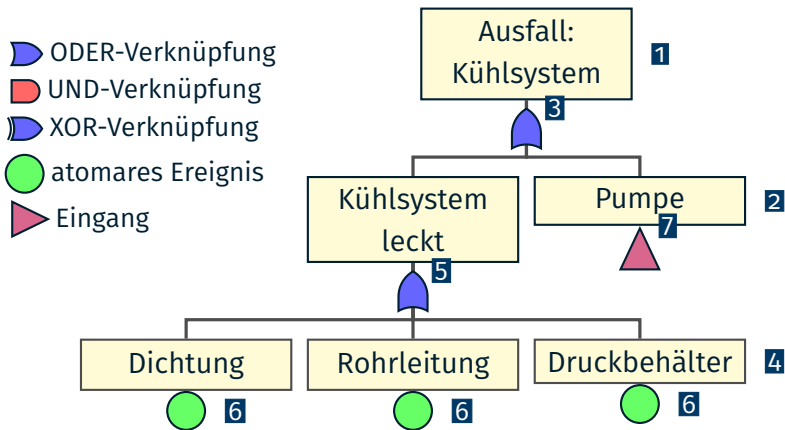
S0	keine Verletzungen
S1	leichte Verletzungen
S2	schwere o. lebensbedrohliche Verletzungen
S3	lebensbedrohliche o. tödliche Verletzungen

Zusammenhang: Defekt \leftrightarrow Fehlverhalten

Welche Defekte führen zum beobachtbaren Fehlverhalten?

- ☞ Eine *Fehlerbaumanalyse* (engl. *fault-tree analysis*) [3, 8] ermittelt die zum beobachtbaren Systemverhalten führenden Ereignisse:
 - *Verfeinernde Analyse* (engl. *top-down analysis*)
 - Das unerwünschte Fehlverhalten bildet die Wurzel des Fehlerbaumes
 - Ausgehend davon werden die Ursachen des Fehlverhaltens identifiziert
 - Arbeitet auf dem *Fehlerraum* (engl. *failure space*) des Systems
 - *Zuverlässigkeitsblockdiagrammen* (engl. *reliability block diagrams*)
 - Diese befassen sich mit dessen korrekter Funktion
- Beispiel: Reaktorkühlsystem eines Kernkraftwerks fällt aus
 - Das Kühlsystem leckt **oder**
 - Eine Dichtung ist defekt **oder**
 - Eine Rohrleitung hat einen Riss **oder**
 - Der Reaktordruckbehälter hat einen Riss
 - Die Kühlmittelpumpe funktioniert nicht
 - Die Pumpe ist defekt **oder**
 - Die Energieversorgung ist ausgefallen

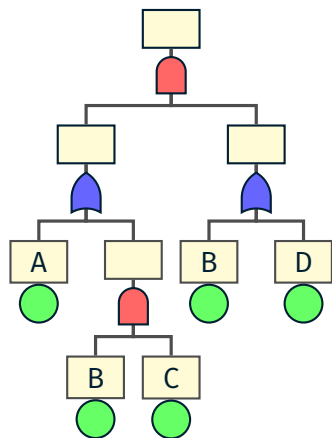
Aufbau und Erstellung von Fehlerbäumen



1. Schadensereignis
2. Ereignisse auf Ebene 2
3. Logische Verknüpfung
4. Ereignisse auf Ebene 3
5. Logische Verknüpfung
6. Atomare Ereignisse
7. Eingänge zerlegen den Fehlerbaum → Neuer Teilbaum

Schnitte und Fehlerbäume Welche Defekte führen letztendlich zum Systemausfall?

- Ein *Schnitt* (engl. *cut-set*) enthält genau die atomaren Ereignisse, die das Schadensereignis verursachen:



- $\{A, B, D\}$ wäre eine solche Menge
- *Minimalschnitte* (engl. *minimal cut-sets*) besonders interessant
 - Minimaler Auslöser
 - z. B. $\{A, B\}$, $\{A, D\}$, $\{B, C\}$
- Fehlerbäume als *logische Ausdrücke*
 - Umformung durch Aussagenlogik
 - Bestimmung durch *SAT-Solving*

- ☞ Minimalschnitte liefern genau die *kritischen atomaren Ereignisse*, die ein unerwünschtes Systemverhalten **hervorrufen**
- ⚠ Diese Defekte(-szenarien) sind zu vermeiden!
- Duales Konzept: *Minimalpfade* (engl. *minimal path-sets*)
 - Die minimale Menge *atomarer Ereignisse*, welche das unerwünschte Schadensereignis **verhindern**
 - Sofern die mit ihnen verbundenen Defekte nicht auftreten
 - Es *genügt* also, diese Defekte auszuschließen!
 - Berechnung: Tausche UND- und ODER-Verknüpfungen
 - Bestimme anschließend die entsprechenden Minimalschnitte
 - Im Beispiel auf Folie III/22 sind dies: $\{A, B\}$, $\{A, C\}$, $\{B, D\}$

- 1 Fehler
- 2 Verlässlichkeitsmodelle
- 3 Fehler und Systementwurf
- 4 Software- und Hardwarefehler**
- 5 Zusammenfassung

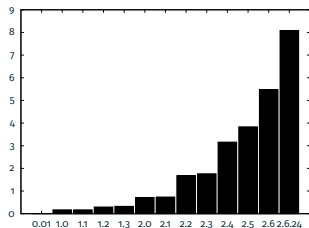
Softwarefehler (engl. software bugs)

- Softwarefehler sind stets *permanente Defekte*
 - Manifestieren sich nicht zwingend in permanentem Fehlverhalten
 - Beispiel: Therac-25 (vgl. Folien II/3 ff)
 - Beispiel: *Heisenbugs* verursacht durch Synchronisationsfehler
 - Auch *Bohrbugs*, *Mandelbugs* oder *Schrödinbugs*
 - Treten manchmal auf, manchmal nicht \leadsto sehr schwer zu reproduzieren
- Ursache: *Fehlerhafte Umsetzung* der Spezifikation
 - In der Regel durch den Programmierer, Architekten, ...
 - Ursprung: Anforderungserhebung, Entwurf, Implementierung, ...
- Softwarefehler sind **systematische Fehler**
 - Betrieb mehrerer Instanzen unter *gleichen, äußeren Bedingungen* führt zu **identischen Fehlern**
 - Äußere Bedingungen sind allerdings nicht ohne Weiteres reproduzierbar
 - Beispiel: Ausfall von SRI 1 und SRI 2 (vgl. Folien II/17 ff) der Ariane 5 [11]

Softwarefehler – Ursachenforschung

- ☞ **Komplexität** ist der **natürliche Feind** korrekter Programme
 - Komplexität nimmt stetig zu: (Million-)LOC

Linux Kernel



Microsoft Windows [12]

Jahr	Produkt	Dev	Test	MLOC
1993	NT 3.1	200	140	4-5
1994	NT 3.5	300	230	7-8
1995	NT 3.51	450	325	9-10
1996	NT 4.0	800	700	11-12
1999	NT 5.0	1400	1700	> 29
2001	NT 5.1	1800	2200	40
2003	NT 5.2	2000	2400	50

- Angefangen hat Linux in Version 1.0 mit ca. 170 KLOC
- In Version 3.0 ist Linux bei ca. **15 Millionen LOC** angekommen
- In Version 4.15 ist Linux bei ca. **20 Millionen LOC** angekommen

⚠ **Faustregel:** ca. 3 Defekte je 1000 LOC

- Pessimistischere Schätzungen: bis zu 10 Defekten je 1000 LOC
- **Hunderttausende Defekte** in Linux 3.0 bzw. Windows NT 5.2

Software will gepflegt werden!

- Folgender Zusammenhang ist einfach interessant
 - Hier wird explizit **keine Kausalbeziehung** aufgestellt!
- Chou, SOSP 2001 [2]: Den Großteil der Softwaredefekte im Linux-Kern findet man in Gerätetreibern
 - Wenig verwunderlich: Der Großteil des Linux-Kerns sind Gerätetreiber
 - **Aber:** auch die Fehlerrate ist in Gerätetreibern am größten
- Padioleau, EuroSys 2006 [14]: Gerätetreiber und die zugehörigen Bibliotheken wachsen im Linux-Kern am stärksten
 - Bibliotheken und Treiber ändern sich ständig
 - Änderungen an den Bibliotheken erfordern Änderungen in den Treibern
 - *Fehlendes Detailwissen* bei *Refactoring*
- Kim, ICSE 2011 [9]: Welche Rolle spielt Refactoring?
 - Ergebnis: Mehr Fehlerbehebungen nach Refactoring
 - Fehler durch **fehlerhaftes Refactoring**

■ *Permanente Hardwarefehler*

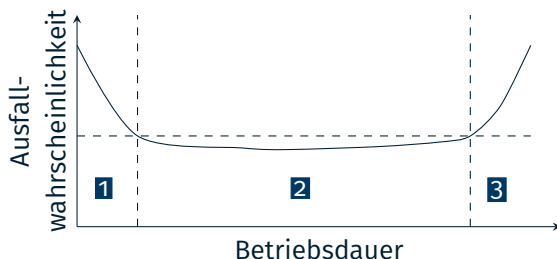
- *Extrinsischer Natur*: Herstellungsbedingte Materialfehler
 - z. B. fehlerhafte Dotierung eines Halbleiters oder Materialunreinheiten
 - Treten meist zu Beginn der Lebenszeit auf (\leadsto *Produktionsausschuss*)
- *Intrinsischer Natur*: Verschleißerscheinungen
 - Kündigen sich meist durch sporadische Fehler an
 - Treten meist am Ende der Lebenszeit auf

■ *Transiente Hardwarefehler* \mapsto Umwelteinflüsse

- Mannigfaltige Ursachen
 - Radioaktive Strahlung
 - Elektromagnetische Interferenz
 - Instabile Spannungsversorgung
 - Fertigungsstreuung bei einzelnen Transistoren
 - Temperaturschwankungen führen zum temporären Materialdefekten
 - ...

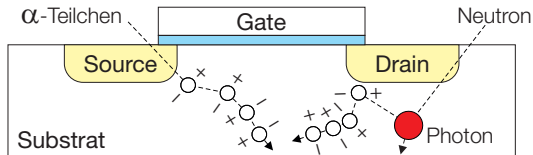
\rightarrow Treten als schwer zu fassende „*Bitkipper*“ in Erscheinung

Wahrscheinlichkeit permanenter Hardwarefehler



1. Erhöhte **Rate von Produktionsausschuss**: fertigungsbedingte Defekte
 - *Einbrennphase* (engl. *burn-in*) filtert fehlerhafte Teile (z.B. Übertaktung)
2. Normaler, sinnvoll nutzbarer **Betriebszeitraum**
 - Ausfallrate nahe an der durchschnittlichen Ausfallwahrscheinlichkeit
3. Durch **Verschleiß** bedingte Ausfälle
 - Auch Halbleiterbauelemente unterliegen einem Verschleißprozess
 - z. B. Elektromigration, Spannungsrisse durch thermische Belastungen, Verschleiß der Oxidschicht am Gate ...

Transiente Hardwarefehler, engl. soft errors



- ☞ **Bitkipper** durch *Umladungen in Speicherzellen und Schaltkreisen*
 - Ionisierende Strahlung erzeugt *Elektronen-Loch-Paare* (Defektelektronen)
- Direkt durch *Alphateilchen*
 - Quelle: Kontaminierte Chipgehäuse oder Lötkekeln
 - Die „ersten transienten Fehler“ [13, Kapitel 1.1]
- Indirekt durch Neutronen aus der *kosmischen Strahlung*
 - *Primäre kosmische Strahlung*: Galaktische und solare Partikel
 - *Sekundäre Strahlung*: Wechselwirkung in der Erdatmosphäre
 - *Terrestrische Strahlung*: Die Erdoberfläche erreichende Partikel
- ☞ *Elektromagnetische Interferenzen, thermische Strahlung, zu geringe Spannungen*
 - Verfälschung von *Kommunikation auf Bussen*
 - z. B. in Automobilen gibt es starke Quellen für Wechselfelder
 - **Sparsame elektronische Abschirmung** macht dies zum Problem

Anfälligkeit für transiente Fehler

- ☞ *Fehlerrate* (engl. *soft-error rate, SER*) eines Schaltkreises hängt (stark vereinfacht) von folgenden Faktoren ab:

$$SER = C \times \text{Neutronenfluss} \times \text{Fläche} \times e^{-Q_{crit}/Q_{coll}}$$

C prozess- und schaltkreisspezifische Konstante

Fläche des Schaltkreises

Q_{crit} minimale für eine Fehlfunktion notwendige Ladung

- Typischer Wert: 1 fC

Q_{coll} Effizienz der Ladungsaufnahme

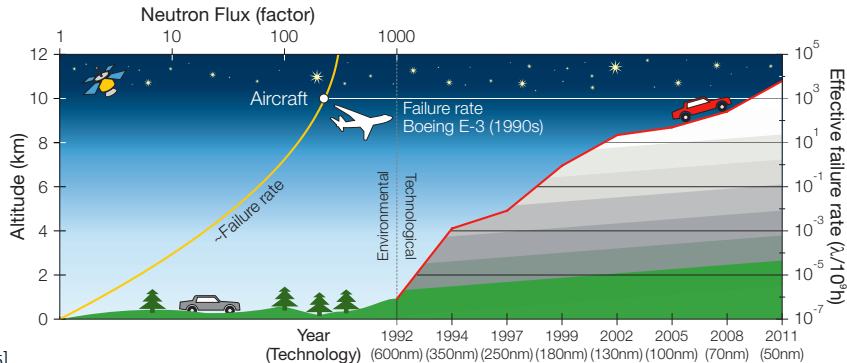
- Bestimmt durch die für die Erzeugung der Elektronen-Loch-Paare notwendige Energie
- Abhängig von Material und Fertigungsprozess \rightarrow *Bremsvermögen* (engl. *stopping power*)
- Typischer Wert: $4.5 \text{ fC } \mu\text{m}^{-1} \sim 22 \text{ keV}$ Teilchenenergie ausreichend

⚠ *Kleinere Halbleiterstrukturen* sind Fluch und Segen zugleich

\rightarrow Kleinere Fläche \sim kleinere SER

\rightarrow Kleinere Q_{crit} \sim größere SER

Fehlerraten – Entwicklung und Tendenzen



Zahlen aus: [15]

- ⚠️ Exakte Fehlerrate ist schwer zu ermitteln
 - Fehlerrate *pro Bit* stagniert oder verbessert sich
 - Fehlerrate des *Systems* hängt indes von vielen Faktoren ab
- 👉 *Vorhersagen* von Forschern und Herstellern [1, 5]
 - Mehr Leistung und Parallelität \leadsto **Auf Kosten der Zuverlässigkeit**

- 1 Fehler
- 2 Verlässlichkeitsmodelle
- 3 Fehler und Systementwurf
- 4 Software- und Hardwarefehler
- 5 Zusammenfassung**

Fehler \leadsto Alles dreht sich ausschließlich um Fehler!

- Fehlerfortpflanzung: Defekt \leadsto Fehler \leadsto Fehlverhalten-Kette
- permanente, sporadische und transiente Fehler
- Vorbeugung, Entfernung, Vorhersage und Toleranz

Verlässlichkeitsmodelle \leadsto Umgang mit Fehlern?

- Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, Wartbarkeit und Verfügbarkeit

Systementwurf \leadsto Bereits hier werden Fehler berücksichtigt!

- Gefahren-, Risiko- und Fehlerbaumanalyse

Software- vs. Hardwarefehler \leadsto Klassifikation & Ursachen

- Softwarefehler \rightarrow permanente Defekte, Komplexität
- Hardwarefehler \rightarrow permanente & transiente Fehler, Fertigung, ionisierende Strahlung, elektromagnetische Interferenz

[1] Borkar, S. :

Designing reliable systems from unreliable components: the challenges of transistor variability and degradation.

In: *IEEE Micro* 25 (2005), November, Nr. 6, S. 10–16.

<http://dx.doi.org/10.1109/MM.2005.110>. –

DOI 10.1109/MM.2005.110. –

ISSN 0272–1732

[2] Chou, A. ; Yang, J. ; Chelf, B. ; Hallem, S. ; Engler, D. :

An empirical study of operating systems errors.

In: Marzullo, K. (Hrsg.) ; Satyanarayanan, M. (Hrsg.): *Proceedings of the 18th ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP '01)*.

New York, NY, USA : ACM Press, 2001. –

ISBN 1-58113-389-8, S. 73-88

[3] Deutsches Institut für Normung:

Fehlerbaumanalyse; Handrechenverfahren zur Auswertung eines Fehlerbaumes.

Berlin, Wien, Zürich : Beuth-Verlag, 1990 (DIN 25424)

[4] Deutsches Institut für Normung:

Qualitätsmanagement – Begriffe.

Berlin, Wien, Zürich : Beuth-Verlag, 1995 (DIN 8402)

[5] Dixit, A. ; Heald, R. ; Wood, A. :

Trends from ten years of soft error experimentation.

In: *Proceedings of the 5th Workshop on Silicon Errors in Logic – System Effects (SLSE '09)*, 2009

[6] IFIP:

Working Group 10.4 on Dependable Computing and Fault Tolerance.

<http://www.dependability.org/wg10.4>, 2003

[7] International Organization for Standardization:

Part 3: Concept phase.

Genf, Schweiz : International Organization for Standardization, 2011
(ISO 26262: Road vehicles – Functional safety)

[8] Kaiser, B. ; Liggesmeyer, P. ; Mäckel, O. :

A new component concept for fault trees.

In: *SCS '03: Proceedings of the 8th Australian workshop on Safety critical systems and software.*

Darlinghurst, Australia, Australia : Australian Computer Society, Inc., 2003. –

ISBN 1-920-68215-5, S. 37-46

[9] Kim, M. ; Cai, D. ; Kim, S. :

An empirical investigation into the role of API-level refactorings during software evolution.

In: Taylor, R. N. (Hrsg.) ; Gall, H. (Hrsg.) ; Medvidović, N. (Hrsg.):
Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering (ICSE '11).

New York, NY, USA : ACM Press, Mai 2011. –

ISBN 978-1-4503-0445-0, S. 151-160

[10] Kopetz, H. :

Simplicity is Complex.

Springer, 2019

[11] Le Lann, G. :

An analysis of the Ariane 5 flight 501 failure – a system engineering perspective.

In: *Proceedings of International Conference and Workshop on Engineering of Computer-Based Systems (ECBS 1997).*

Washington, DC, USA : IEEE Computer Society, März 1997. –

ISBN 0-8186-7889-5, S. 339-346

[12] Maraia, V. :

The Build Master: Microsoft's Software Configuration Management Best Practices.

Addison-Wesley, 2005. –

ISBN 978-0321332059

[13] Mukherjee, S. :

Architecture Design for Soft Errors.

San Francisco, CA, USA : Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2008. –
ISBN 978-0-12-369529-1

[14] Padioleau, Y. ; Lawall, J. L. ; Muller, G. :

Understanding Collateral Evolution in Linux Device Drivers.

In: Berbers, Y. (Hrsg.) ; Zwaenepoel, W. (Hrsg.): *Proceedings of the ACM SIGOPS/EuroSys European Conference on Computer Systems 2006 (EuroSys '06).*

New York, NY, USA : ACM Press, Apr. 2006. –
ISBN 1-59593-322-0, S. 59-71

- [15] Shivakumar, P. ; Kistler, M. ; Keckler, S. W. ; Burger, D. ; Alvisi, L. :
Modeling the Effect of Technology Trends on the Soft Error Rate of Combinational Logic.
In: *Proceedings of the 32nd International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN '02)*.
Washington, DC, USA : IEEE Computer Society Press, Jun. 2002, S. 389–398